# 有機薄膜太陽電池の構造評価の試み

東京農工大学 工学部·化学物理工学科 箕田弘喜

Attempt to Evaluate the Structure of Organic Thin Film Solar Cells

## Hiroki Minoda

## Faculty of Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology

有機太陽電池(OPV)のバルクヘテロ接合(BHJ)構造を制御することは、電力変換効率を 向上させるために不可欠であり、BHJの有機半導体ドメインの界面を視覚化することは、 OPVの開発にとって重要である。ただし、BHJ界面構造の評価は、有機ドナードメイン と有機アクセプタードメインが近接しているため、多くの場合困難である。接合部での効 率的な励起子の分離を維持するために、これらの有機ドメインの間隔は通常100ナノメー トル未満である。この研究では、BHJの界面構造を可視化するために、ドナーとして金 属を含まないフタロシアニン(H<sub>2</sub>Pc)とアクセプターとしてフラーレン(C<sub>60</sub>)で構成される サブミクロン厚さの OPV を採用し、位相板走査透過型電子顕微鏡(P-STEM)により、数 +ナノメートルの間隔で BHJ の界面構造を視覚化することに成功した。この結果は、有 機ハイブリッド材料の分析における P-STEM の大きな可能性を明確に示している。

Controlling the bulk heterojunction (BHJ) structure of organic photovoltaic cells (OPVs) is essential for improving their power conversion efficiency. Visualizing the interfaces of the organic semiconductor domains in BHJs is important for the development of OPVs. However, the evaluation of the BHJ interface structure is often challenging owing to the close proximity of donor and acceptor organic domains, which are typically spaced less than one hundred of nanometers for keeping efficient exciton separation at the junction. In this study, a sub-micrometer-thick OPV composed of metal-free phthalocyanine (H<sub>2</sub>Pc) as the donor and fullerene (C<sub>60</sub>) as the acceptor was adopted to visualize the interface structure of BHJs. Phase plate scanning transmission electron microscopy (P-STEM) enabled the visualization of the interface structure of the BHJ with a spacing of tens of nanometers. This observation clearly demonstrates the significant potential of P-STEM for analyzing organic hybrid materials.

# 1. はじめに

再生可能エネルギーの生産拡大は持続可能な社会にとって不可欠である。そのため、再 生可能エネルギーの生産方法である太陽電池のエネルギー変換効率の向上が必須となって いる。有機材料をエネルギー変換用の半導体として使用する有機太陽電池(OPV)は、製造 コストの観点から有望な太陽電池と考えられている<sup>1-3</sup>。当初、OPV はドナー材料層とア クセプター材料層で構成される二層構造として製造された<sup>1</sup>。しかし、受光面積や活性層 を大きくして得られるパワーを大きくしようとしても効果はなかった。これは、光照射に より発生した電子や正孔の拡散長が短く、すぐに消滅することが理由である。励起子の拡 散長は通常、数十ナノメートル<sup>3,4</sup>で、電荷キャリア(電子と正孔)の短い拡散長に適合す るようにセル構造を最適化する必要がある。この問題を克服するために、規則的なバルク ヘテロ接合(BHJ)の形成が提案された<sup>5-7</sup>。

OPVの開発における課題は、膜の成長の制御である。ドナー材料とアクセプター材料 を使用した結晶性の高いデバイスの製造と、BHJの界面構造の制御は、高いエネルギー 変換効率を実現するために必要である。したがって、界面構造の評価はOPV研究にとっ て重要である。ただし、有機材料は軽元素で構成されているため、これは困難で、X線回 折が結晶構造を調べるために広く使用されている。ただし、X線回折は試料の局所構造や BHJの界面構造を明らかにするのには適していない。走査型電子顕微鏡(SEM)も試料構 造を研究するための一般的な方法であり、SEM 観察の詳細についてはこの論文で説明す るが、SEM を使用してドナー材料とアクセプター材料を同時に区別することはできない。 原子間力顕微鏡も構造研究のための強力なツールであるが、調べられるのは表面構造のみ であり、OPV デバイス内の界面構造は評価できない。したがって、OPVの界面構造を解 析するための適切な可視化手法を確立する必要がある。

この研究では、位相差走査型透過電子顕微鏡(P-STEM)<sup>8-10</sup>を使用して、真空蒸着および共蒸着によって作製されたフラーレン(C<sub>60</sub>)と金属フリーのフタロシアニン(H<sub>2</sub>Pc)で構成される OPV の構造評価を試みた。ポリジメチルシロキサン(PDMS)の共蒸着法を使用して、成長する 2 つの分子の拡散を強化して BHJ の構造を制御した。これらの OPV は軽元素のみで構成されており、電子顕微鏡での像のコントラストが低いため、これまでこのBHJ を構成する 2 種類の分子の分布を実験的に示した研究報告はない。

#### 2. 試料および方法

実験に使用した OPV は、C<sub>60</sub>と、共蒸発剤誘起結晶化法によって生成された金属を含 まないフタロシアニン(H<sub>2</sub>Pc:C<sub>32</sub>H<sub>18</sub>N<sub>8</sub>)で構成されている。この系では、H<sub>2</sub>Pc がドナー(p 型)成分、C<sub>60</sub> がアクセプター(n型)成分ですある。基板温度は 70℃で、C<sub>60</sub> および H<sub>2</sub>Pc の堆積速度はそれぞれ 1.0 および 1.4Å/秒とした。デバイスの界面構造を制御し、高度 に秩序化された BHJ を得るために、共蒸発成分としてポリジメチルシロキサン(PDMS) を 0.35Å/s の蒸発速度で使用した <sup>11-12</sup>。電子顕微鏡用試料は 2 つの方法で作製した。 SEM 試料は、酸化インジウムスズ(ITO)電極を備えたガラス板を、ダイヤモンドガラス カッターを使用して切断して準備し、その断面を観察した。走査型透過型電子顕微鏡 (STEM)用試料は、集束イオンビーム(FIB)(日本電子 JIB-4500)を用いて厚さ約 100 nm の 薄片を切り出し、透過型電子顕微鏡(TEM)用マイクログリッド上に置き、P-STEM 観察 を行った。

SEM 観察は、電界放射型電子銃を備えた走査型電子顕微鏡 (JEOL JSM-6700 F)を用いて 実施した。STEM 観察は、電界放出型電子銃と STEM 用位相板 (PP) 交換用エアロックシ ステムを備えた 200 kV 透過型電子顕微鏡 (JEOL JEM-2100 F)を用いて行った。OPV のド メイン構造の観察には、私たちが開発した P-STEM を使用した<sup>8-10</sup>。位相板としてゼルニ ケ位相板 (ZPP)を使用した。ZPP は、中心に小さな穴のあるアモルファスカーボン薄膜 (厚 さ約 25 nm) である。この厚さのカーボン薄膜は、200 keV の運動エネルギーを持つ電子に  $\pi/2$  の位相変調を引き起こすことができる。

### 3. 結果と考察

図1(a)と1(b)はSEM 画像の例を示しており、 黒い矢印はITO 電極を示している。図1(a)は上部 電極のない領域を示し、図1(b)は黒い矢頭で示さ れるAg上部電極のある領域を示す。試料領域は ITO 電極上に約700~800nmの厚さに成長した。試 料は同じ条件で調製されたが、異なる見た目の構造 を示している。さらに、試料領域の上に突き出た白 い矢印で示される白いスパイクが観察された。図1 (b)では電極が上にあるためスパイクはほとんど見 えないが、図1(a)では上面全体に多数の針状構造 が観察される。

SEM では二次電子の放出確率の違いにより画像 のコントラストが生じる。二次電子に含まれる反射 電子は組成の違いを観察するためによく使用される が、今回の研究で用いた SEM 画像を構成する二次 電子強度に占める反射電子強度の割合は大きくない ため、組成由来のコントラストを得ることは困難で ある。一方、検出される二次電子の大部分を占める 低エネルギー二次電子は、傾斜面の画像では明るく 見えることが知られており、凹凸形状を示す地形画 像の取得などに利用されている。

C<sub>60</sub>は炭素のみで構成されているが、H<sub>2</sub>Pcには



Fig. 1 (a), (b) Two examples of the SEM images. Black arrows indicate the ITO substrate and a black arrow head indicates an Ag electrode. A white arrow indicates one of the needle-like structures protruding above the Ag electrode. A white scale bar (at the left bottom in (a)): 200nm.

水素、窒素、炭素が含まれている。どの分子も原子番号が小さく、組成の違いによる二次 電子放出確率の差が小さい原子で構成されている。これにより、C<sub>60</sub>ドメインとH<sub>2</sub>Pcド メイン間のコントラストが非常に弱くなることが予想される。したがって、これら2つの 画像で観察されるコントラストは試料の形態に関連していると結論付けることができる。 ガラス基板をガラスカッターで切断したところ、比較的密度の低い部分に亀裂が入り、亀 裂がガラス表面にまで伸び、亀裂部分の断面が露出した。表面は膜の下にある構造ではな く、断面の粗さを反映する。白い矢印で示すように、試料の上部に形成されたスパイクは、 おそらくその形状のため、他の領域のものより明るく見えている。観察された表面領域で は分子分布の密度が低く、表面形態は膜の構造によって影響を受けたが、C<sub>60</sub>と H<sub>2</sub>Pc の 分布によっては影響を受けなかった。したがって、SEM 画像は C<sub>60</sub> 相と H<sub>2</sub>Pc 相の分布 に関する情報を提供できず、BHJ の界面構造を評価するために使用することはできない といえる。

図2は、2つの異なる光学条件下で取得された C<sub>60</sub> および H<sub>2</sub>Pc の OPV 試料の STEM 画 像の比較を示している。どちらの画像にも位相コントラストと散乱コントラストが含まれ ているが、図2(a)は ZPP を使用して取得した P-STEM 画像を示しており、主に位相コン トラストを示している。一方、図2(b)は、ZPP を使用せずに取得した同じ視野の STEM 画像で、主に散乱コントラストを示している。画像の明るさは、コントラストを直接比較 できるように調整してある。画像の下からカーボン膜、黒く見える ITO 膜、試料領域で

あり、一番下のカーボン膜は、イオン処理中に試 料部品が削られるのを避けるために、カバーとし て形成したものである。図2(b)の散乱コントラ スト画像では画像のコントラストが低いことがわ かるが、図2(a)では、ZPP が使用されているた め画像のコントラストが高くなっている。この試 料は FIB 加工を使用して作製されており、顕著 な表面粗さは観察されない。したがって、これら の画像コントラストは、SEM で見える形態学的 コントラストからではなく、試料の内部構造から 得られたものである。この像から、OPV内では 下地から垂直方向に長く伸びた針状構造が形成さ れていることがわかる。この構造は BHJ の形成 に対応していると考えられる。明暗のコントラス トは、C<sub>60</sub>ドメインとH<sub>2</sub>Pcドメインの質量密度 の違いから説明することができる。

比較的大きな構造の画像コントラストは2つの 画像で類似している。ただし、図2(b)では、微 細なパターンがほとんど見えない。図2(b)に見 られる比較的大きな暗い領域は、図2(a)でも同 様に暗く見え、画像は互いに対応している。これ は、電子と試料との相互作用により位相や散乱強 度の変化が生じたことによるもので、明るいとこ ろは、電子との相互作用が小さい領域に対応して いる。散乱コントラストは、試料の質量厚みに依 存して得られるコントラストで、例えば試料の原



Fig. 2 A comparison of the image contrast of the STEM images (a) with and (b) without the ZPP. The arrows indicate two examples of the same areas which represent similar contrast in both images. A scale bar: 200 nm.

子密度の高い領域で暗く見えることになる。したがって、位相コントラスト(図2(a))や 散乱コントラスト(図2(b))で見える明るい領域と暗い領域が異なる質量密度、すなわち 異なる組成を有していることを示している。微細な構造は強いコントラストを提供せず、 したがって、図2(b)では視覚化できない。この結果は、P-STEM 法が軽元素で構成され た複合材料の分域構造の観察に非常に有効であり、OPV の構造評価に有効であることを 示している。

#### 4. 結論

PDMSと共蒸着された真空蒸着によって製造されたC<sub>60</sub>とH<sub>2</sub>PcからなるOPVの構造 特性評価を、P-STEMを使用して実行しました。薄膜中に針状構造が確認された。この方 法で得られるコントラストにより、試料内の特定の分子の分布に関する情報が得られるた め、この方法は、軽元素で構成されるハイブリッド材料の相分離を研究するのに効率的と 言えます。これは、OPVの断面におけるアクセプター分子とドナー分子の数十ナノメー トルスケールの分布をサブマイクロメートルスケールの視野で直接観察し、OPVのBHJ の構造を明確に可視化した最初の研究です。これらの結果は以前の結果と一致しており、 混合有機材料の構造特性評価における P-STEM の実質的な利点を明確に示しています。 このような構造評価手法の使用は、より効率的な OPV の開発にとって非常に重要です。

# 5. 謝辞

本研究は、令和3年度日本板硝子材料工学助成会の研究助成を受けて行ったものである。 同助成会に心より感謝いたします。

# 6. 参考文献

- 1) Tang C. W.; Two-layer organic photovoltaic cell, *Appl. Phys. Lett.* 48, 183 (1986).
- 2) Zhu L.; Zhang M.; Xu J.; Li C.; Yan J.; Zhou G.; Zhong W.; Hao T.; Song J.; Xue X.; Zhou Z.; Zeng R.; Zhu H.; Chen C. C.; MacKenzie R. C. I.; Zou Y.; Nelson J.; Zhang Y.; Sun Y.; and Liu F.; Single-junction organic solar cells with over 19% efficiency enabled by a refined double-fibril network morphology, *Nature Materials*, *21*, 656 (2022).
- 3) Sajjad M. T.; Ruseckas A.; and Samuel 1 I. D.W.; Enhancing Exciton Diffusion Length Provides New Opportunities for Organic Photovoltaics, *Matter*, 3, 341–354 (2020).
- 4) Guan X.; Wang S.; Liu W.; Qin D.; and Ban D.; Determining the exciton diffusion length of copper phthalocyanine in operating planar-heterojunction organic solar cells, Eur. Phys. J. Appl. Phys., 89, 30201 (2020).
- 5) Peumans P.; Uchida S.; Forrest S. R.; Efficient bulk heterojunction photovoltaic cells using smallmolecular-weight organic thin films, Nature, 425, 158 (2003).
- 6) Scharber M. C. and Sariciftci N. S.; Efficiency of bulk-heterojunction organic solar cells, Progress in Polymer Science, 38, 1929–1940 (2013).
- 7) Hiramoto M.; Fujiwara H.; Yokoyama M.; Three layered organic solar cell with a photoactive interlayer of codeposited pigments, *Appl. Phys. Lett.* 58, 1062 (1991).
- 8) Minoda H.; Tamai T.; Iijima H.; Hosokawa F.; and Kondo Y.; Phase-Contrast Scanning Transmission Electron Microscopy, *Microscopy*, 64, 181–187 (2015).
- Tsubouchi M.; and Minoda H.; Toward complex observation in electron microscopy using two-dimensional electron detector coupled with phase plate STEM, *Microscopy*, 71, 117–123 (2020).
- 10) Togashi M.; and Minoda H.; First step toward complex observations by 4D-STEM with phase plate, Ultramicroscopy, 249, 113729 (2023).
- Kaji T.; Zhang M.; Nakao S.; Iketaki K.; Yokoyama K.; Tang C. W.; and Hiramoto M.; Co-evaporant Induced Crystalline Donor: Acceptor Blends in Organic Solar Cells, *Adv. Mater.* 23, 3320–3325 (2011)
- 12) Kaji T.; Nakao S.; and Hiramoto M.; Effect of Co-evaporant Induced Crystallization on Needle Growth of Phthalocyanine Thin Films, Mol. Cryst. Liq. Cryst. 578, 63 (2013).